



半導體關鍵零件 一站式量測顧問服務

Metrology, Empowering Precision, Driving Quality, Redefining Standards
我們透過專業的量測技術，精準表述零件量化特性以形成品質指標，進而助力打造符合真實使用環境(fab生產機台)的零配件，賦予客戶能自主定義出貨規格、強化產品品質可靠度，並與供應鏈夥伴共同提升品質標準

Who We Are

相弘科技致力於發展半導體關鍵零件檢測技術，並實踐可工業化標準應用，成為您解決零件生產/產線品質異常分析問題的專家。我們提供品質檢測與管理的一站式顧問服務，包括代檢測服務、檢測設備銷售和電子化品質履歷系統等。透過整合式解決方案，客戶能夠實現檢測數據的直觀可視化，優化入料檢驗管理，強化供應鏈管理，進而提升出貨規格的一致性和可靠性



Why Choose Us



半導體製程與先進量測技術專業

提供晶圓廠製程專業，從客戶視角辨識問題，再用客戶語言溝通解決，協助評估與採用合適的高端非破壞式量測技術以取得零件關鍵物理性質數據。



一站式量測顧問解決方案

從識別量測課題、規劃解決方案、可行性驗證、客製評估/開發量測設備、代檢測服務、量測分析報告，再到電子化履歷系統提供品質數據E化介面，一站式高效整合客戶零件品質建立所需支援/資源，最完善協助客戶完成品質管理建立流程的每一個步驟



量測數據可視化

將原始量測數據再處理並利用SPC、2D/3D分析和疊圖等可視化呈現，幫助客戶更直觀地了解關鍵品質信息，以用數據準確溝通和解決問題，同時建立起Golden recipe及UCL/LCL，以持續管理品質。

Our Services

零配件優化 Part CIP

- 原廠 vs 副廠品導入
- 舊品 vs 新品 性能比較
- OK vs NG 關鍵品質差異
- 零配件與機台/製程匹配性與關聯性
- 強化出貨與入料檢驗

代檢測服務

- 可行性驗證
- 關聯性分析報告
- 外觀輪廓/材料分析/電性分析/溫度分析

檢測設備

- 環境與設備微塵粒檢測方案
- HDP Nozzle 噴嘴流量檢測方案
- 外觀輪廓量測: 輪廓儀/彩色共扼焦測(CC)/AOI檢測
- 表面汙染/成份分析量測: XRF元素分析
- 客製化開發設備服務

電子化履歷系統

- 隨時隨地存取與瀏覽
- 可自定義數據格式 生成模板
- Unit-to-Unit 可視化比較
- UCL/LCL設定與離群值警示
- 支援多人協作管理與覆核傳簽

Get In Touch



886-3-555-7312



www.metrocans.com.tw



302 新竹縣竹北市環北路一段329號3樓

一站式品質檢測管理解決方案



QA idea turnkey

提供定制化的品質管理解決方案，包括可行性驗證與代檢測服務、量測技術評估與導入、數據分析、品質基線與配方定義等顧問服務



客戶檢測需求評估

深入了解客戶的具體需求，確定檢測重點和標準



量測方案規劃

設計專業的量測方案，選擇最適合的檢測技術和設備，以確保檢測結果的精確性和可靠性



可行性驗證

在實施方案前進行小規模驗證，確保檢測方法的可行性和有效性



代檢測服務

提供專業的代檢測服務，確保在客戶時間和資源有限的情況下，依然能得到高品質的檢測結果



關聯性分析

對檢測數據進行深度分析，提供數據以定位出品質差異所在，並提出建議以幫助客戶決策



報告出具

提供詳細檢測報告，包括數據分析結果、圖表和改進建議



檢測設備

根據客戶的量測需求，提供專業的設備選型和規格建議，並協助導入量測手法與建立檢測工作流程



電子化履歷系統

讓客戶能夠直觀地理解多樣品的數據分布和離群值，快速識別並處理異常物料，以便更迅速地做出準確的決策，從而提高工作效率和品質管理水平

透過相弘高效統合且專業界面，最完善地協助客戶
完成品質管理建立流程的每一個步驟